

テーマ「SEM の中で何が起きているのか？(2) ～検出器の視覚～」

日時：2019 年 5 月 31 日（金）13:30～17:30

場所：産業技術総合研究所 臨海副都心センター別館 11F 会議室 1
（東京都江東区青海 2-4-7）

参加費：無料

趣旨：近年の走査電子顕微鏡(SEM)がもたらす多様な像情報を正しく理解するためには、試料内での電子散乱の物理に加え、電子光学系・検出系といった装置も含めた議論が必要である。本研究会では前回に引き続き「SEM の中で何が起きているのか？(2)」をテーマに、信号電子検出器を特集したい。研究会前半では特性の異なる検出器を駆使した材料研究や、検出器の像形成への寄与についてご講演いただく。後半はハードウェアの視点から検出器について議論したい。検出器・検出系の概論に続き、その応用例であるイマージョンレンズ光学系中の検出器についてご講演いただく。

－プログラム－

1. 13:30-13:40 はじめに
熊谷 和博（産業技術総合研究所）
2. 13:40-14:20 複数検出器を併用した合金組織の多元的 SEM 解析
赤嶺 大志（九州大学）
3. 14:20-15:00 観察条件に依存した SEM コントラスト
加藤 大樹（日本電子）
- 休憩
4. 15:30-16:10 SEM の検出器・検出系の概論
揚村 寿英（日立ハイテクノロジーズ）
5. 16:10-16:50 Principles of signal electron detection in immersion electron columns
Dr. Petr Wandrol (Thermo Fisher Scientific)
6. 17:00-17:25 討論・質疑応答
7. 17:25-17:30 おわりに
熊谷 和博（産業技術総合研究所）

[申込み方法]

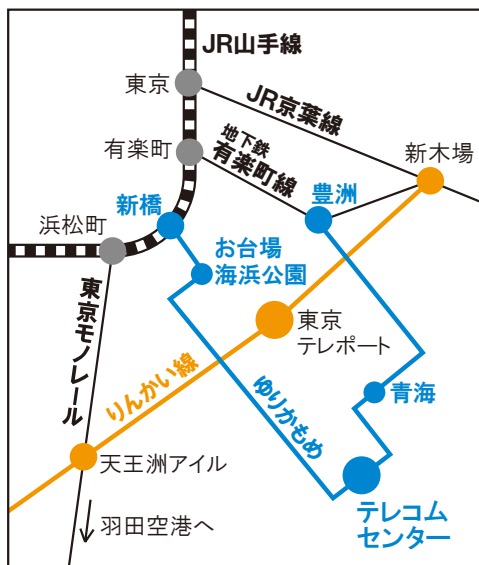
氏名・所属・顕微鏡学会 会員／非会員の別をご記入の上、2019年5月29日(水)までに e-mail にて以下までお申込み下さい。定員(100名)となり次第締め切ります。

日本顕微鏡学会 SEMの物理学分科会 代表世話人 熊谷 和博

e-mail: quaz.kumagai@aist.go.jp

[会場アクセス]

広域路線図



電車のご案内

- ① 新交通ゆりかもめ「テレコムセンター」駅 徒歩3分
- ② りんかい線「東京テレポート」駅下車 徒歩15分



バスのご案内

- ① りんかい線「東京テレポート」駅 または 地下鉄東西線・大江戸線「門前仲町」駅より 都営バス 海01 乗車
- ② JR京浜東北線「大井町」駅西口より 京急バス 井30 井32 乗車
- ③ JR京浜東北線「大森」駅東口より 京急バス 森30 森40 乗車
→「テレコムセンター駅前」バス停下車 徒歩約5分



羽田空港からお越しの場合

空港からモノレール乗車
→「天王洲アイル」駅でりんかい線に乗り換え
→「東京テレポート駅」下車 徒歩15分

周辺地図

